

國立中興大學奈米科技中心 儀器說明會

Instrument meeting in CNN, NCHU

日期：100年9月30日

時間	課程內容	演講者	地點
9:30-10:00	報到		
10:00-10:10	開場	奈米中心主任 楊吉斯 教授	理學大樓 1A01
10:10-12:00	場發射掃描式電子顯微鏡開放使用說明會 Q & A	化學系 林寬鋸 教授	理學大樓 1A01
12:00-13:30	午 餐 時 間		
13:30-15:00	三次元奈米級拉曼磷光共軛雷射顯鏡說明會 Q & A	物理系 施明智 副教授	理學大樓 1A01
15:00-15:10	休 息		
15:10-16:40	可變溫式超高真空掃描探針顯微鏡 JSPM-4500VT Q & A	物理系 蘇志川 先生	理學大樓 1A01

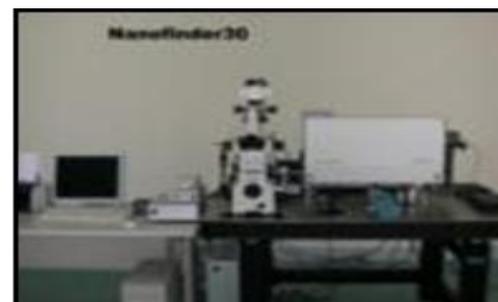


場發射掃描式電子顯微鏡

場發射掃描式電子顯微鏡(FESEM)儀器廠牌為蔡司 ZEISS Ultra Plus 熱場場發射掃描式電子顯微鏡，其解析度可達 1.0 nm(15 kV)，1.7 nm(1.0 kV)，3.5 nm(0.2 kV)，4.0 nm(0.1 kV)可對材料表面形之顯微組織貌進行精細觀察及亦加裝了 X 光能量散譜儀(EDS)，可對材料做進一步微區之元素定性與定量分析。

三次元奈米級拉曼磷光共軛雷射顯鏡

Nanofinder @ 30 為一具高感光度與高解析度的三維拉曼顯微影像分析系統，具有可同時擷取三維影像與材料分析之功能。此光學系統建立於共軛焦顯微鏡的基礎上，因同時裝載有光譜分析儀與時間相干單光子偵測器，因此分別於光譜與時間參數上提供分析材料特性之能力。Nanofinder 具三維顯微拉曼散射或螢光影像偵測，拉曼光譜分析，螢光衰減週期(FLIM)分析等能力，可應用於如活體細胞偵測，半導體與半導體裝置材料與應力分析，磊晶薄膜結構與成分分析，以及石墨(矽)/奈米碳管結構分析等多重領域之研究。



可變溫式超高真空掃描探針顯微鏡 JSPM-4500VT



JSPM-4500VT 為日本 JEOL 公司所製造的超高真空可變溫式掃描探針顯微鏡，具有掃描穿隧顯微術與原子力顯微術、磁力顯微術的功能。其超高真空系統可提供 $<1 \times 10^{-8}$ Pa 的超高真空環境，並具備樣品交換腔體、樣品準備腔體與樣品檢測腔體。此 JSPM-4500VT 可變溫式超高真空掃描探針顯微鏡，所具有的超高真空樣品製備與量測環境、方便更換樣品與探針的設計、以及大範圍溫度調控的能力，使其可以廣泛應用於奈米科學與半導體相關研究領域之中。

國立中興大學奈米科技中心 儀器說明會報名

報名方式：網路報名 <http://nanocenter.nchu.edu.tw/insert.php?id=94>

聯絡人：(04)2284-0502#17 鄧小姐